

書籍のご案内

磁粉探傷試験 I

編集：(社)日本非破壊検査協会

編集委員長 加藤 光昭

体裁：B5版，82頁

定価：本体1,905円＋税（送料別）

磁粉探傷試験は、強磁性体の表面又は表面近傍に存在するきずを検出する方法として優れた能力をもっている試験法であり、重要な機器、構造物及び溶接部などの検査に広く利用されています。磁粉探傷試験には試験対象物及び目的に応じて種々な方法が適用されているため、それらの方法の原理を十分に理解するとともに、試験方法にも熟達して間違いのない試験を実施する必要があります。

本書は、1989年に“非破壊検査技術シリーズ 磁粉探傷試験 I”として初版が刊行されました。その後、見直しを適宜行ってきました。今回は、JIS Z 2305:2001 “非破壊試験-技術者の資格及び認証”に基づく認証が2001年から開始されたことに対応するため、磁粉探傷試験部門のレベル1の資格を取得しようとする方がもっていただきたい基礎知識及び実際の試験方法の内容について見直しを行って、改訂版として刊行したものです。

また、JIS G 05605が改定され、JIS Z 2320として制定された（JIS G 0565は廃止されました）ため、必要な箇所はこれらの内容に準じて書き換えをしました。

以下に目次を示す。

- 1 磁粉探傷試験に必要な基礎知識
- 2 磁粉探傷試験
- 3 各種磁化方法と探傷の実際
- 4 A形及びC形標準試験片
- 5 試験に必要な磁化機器と材料
- 6 磁粉探傷で対象となるきずの種類
- 7 記録
- 8 指示書

以上

